

# E DIN/TS 70214:2024-01 (D)

Erscheinungsdatum: 2023-12-15

## Straßenfahrzeuge - Validierung von Automotive-Niedervolt-Steckverbindern

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	10
Einleitung .....	11
1 Anwendungsbereich.....	12
2 Normative Verweisungen .....	12
3 Begriffe .....	12
3.1 Begriffe zu elektrischen Leitungen.....	12
3.2 Begriffe zu Verbindungstechniken .....	13
3.3 Begriffe zu Kontaktierungen .....	13
3.4 Begriffe zu weiteren Komponenten .....	15
4 Symbole und Abkürzungen .....	16
5 Allgemeines .....	17
6 Prüfungsbeschreibungen.....	19
7 Prüfmatrix Kontakte .....	23
8 Prüfmatrix Gehäuse.....	26
9 Prüfmatrix Dichtungen/Dichtelemente.....	28
10 Prüfmatrix Stiftleiste.....	30
11 Legende Prüfmatrix.....	31
12 Klassifizierung.....	32
12.1 Temperaturklassen .....	32
12.2 Dichtheitsklassen, Wasserdichtheit.....	32
12.3 Vibrationsklassen (Verbrennungsmotoren, typische Einbaubereiche).....	33
13 Bewertung Kontaktoberflächen nach Prüfungen .....	33
13.1 Allgemeines.....	33
13.2 Analyse und Bewertung der Kontaktstellen mit den nachfolgend beschriebenen Methoden .....	34
13.2.1 Allgemeines.....	34
13.2.2 Kriterien für Zinnoberflächen.....	35
13.2.3 Kriterien für Goldoberflächen .....	35
13.2.4 Kriterien für Silberoberflächen.....	35
14 Schliffbilderstellung .....	35
15 PG 0 — Widerstandsprüfung .....	36
15.1 Zweck .....	36
15.2 Anforderung.....	36
15.3 Kontaktteilprüfung.....	36
15.4 Gehäuseprüfungen.....	37
16 PG 1 — Maße .....	38
17 PG 2 — Material- und Oberflächenanalyse, Kontakte .....	39
18 PG 3 — Material- und Oberflächenanalyse, Gehäuse und Dichtelemente.....	41
19 PG 4 — Kontaktüberdeckung / Freiraum.....	42

20	PG 5 — Mechanisches und thermisches Relaxationsverhalten.....	43
21	PG 6 — Wechselwirkung zwischen Kontakt und Gehäuse.....	45
21.1	Allgemeines.....	45
21.2	PG 6 — Wechselwirkung zwischen Kontakt und Gehäuse — Falltest.....	47
22	PG 7 — Handhabung und Funktionssicherheit der Gehäuse .....	49
23	PG 8— Einstech- und Haltekräfte der Kontaktteile im Gehäuse.....	53
24	PG 9— Kontaktgeschütztes Design (Koshiri-Sicherheit) .....	56
25	PG 10— Kontakte Leitungsausreißkraft .....	58
26	PG 11 — Kontakte: Steck- und Ziehkräfte, Steckhäufigkeit.....	60
27	PG 12— Stromerwärmung, Derating .....	61
28	PG 13— Gehäuseeinfluss auf das Derating .....	64
29	PG 14— Kurzzeitige Überlast ( $t > 100$ ms, Stromübertemperatur bei n-fachem Nennstrom) .....	67
30	PG 15— Elektrischer Stresstest .....	69
31	PG 16— Reibkorrosion.....	73
32	PG 17 — Dynamische Beanspruchung.....	74
32.1	Allgemeines.....	74
32.2	PG 17— Dynamische Beanspruchung — Prüfablauf .....	77
32.3	PG 17 — Dynamische Beanspruchung — Aufspannung auf dem Schwingtisch .....	78
32.4	PG 17 — Dynamische Beanspruchung — Vibrationsklassen.....	80
32.4.1	PG 17 — Vibrationsklasse V1 .....	80
32.4.2	PG17 — Vibrationsklasse V2 .....	81
32.4.3	PG 17 — Vibrationsklasse V3 .....	83
32.4.4	PG17 — Vibrationsklasse V4 .....	84
32.4.5	PG17: Vibrationsklasse V5 .....	86
32.4.6	PG 17: Vibrationsklasse V6 .....	87
33	PG 18A — Küstenklimabeanspruchung.....	89
34	PG 18C: Streusalzbeanspruchung .....	90
35	PG 19 — Umweltsimulation.....	91
36	PG 20 — Klimatische Beanspruchung der Gehäuse .....	96
37	PG 21 — Langzeittemperaturlagerung.....	98
38	PG 22A — Chemische Beständigkeit .....	99
39	PG 22B — Chemische Beständigkeit, erweiterte Prüfung.....	101
40	PG 23 — Wasserdichtheit .....	103
41	PG 28 — Verriegelungs-Geräusch .....	107
42	PG 29 — Haltekraft der Blindstopfen .....	108
43	PG 31: Messung der Haltekräfte von Stiftkontakte in Stiftwannen / Steckergehäusen .....	110
44	PG 32 — Überwachungsfähigkeit von Crimp-Kontakten .....	112
45	PG 33— Crimpvalidierung — Slow Motion Prüfung .....	121
46	PG 34: Handlingsprüfung.....	131
	Anhang A (normativ) Anhang zur Validierung von Automotive-Niedervolt-Steckverbindungen zur Datenübertragung .....	132
A.1	Einleitung.....	132
A.2	Anwendungsbereich.....	132
A.3	Abweichungen.....	132

A.3.1	Ergänzung zu E 0.2 Durchgangswiderstand .....	132
A.3.2	Ergänzung zu E 0.3 Isolationswiderstand .....	132
A.3.3	Ergänzung zu PG 0 .....	133
A.3.4	Ergänzung zu PG 7 .....	133
A.3.5	Ergänzung zu PG 8 .....	134
A.3.6	Ergänzung zu PG 10 .....	134
A.3.7	Ergänzung zu PG12 .....	134
A.3.8	Ergänzung zu PG 13 .....	135
A.3.9	Ergänzung zu PG 20 .....	135
A.3.10	Ergänzung zu PG 21 .....	135
A.3.11	Ergänzung zu PG 23 .....	135
A.3.12	Ergänzung zu PG 31 .....	135

## Bilder

<b>Bild 1 — Schematischer Messaufbau Widerstandsmessung (Vierleitermessung)</b> .....	20
<b>Bild 2 — Lage der Schliefebene</b> .....	36
<b>Bild 3 — Exemplarische Darstellung Durchgangswiderstand im Kontaktbereich</b> .....	37
<b>Bild 4 — Exemplarische Darstellung Durchgangswiderstand im Anschlussbereich</b> .....	38
<b>Bild 5 — Messung des Isolationswiderstandes zwischen allen benachbarten Kontakten</b> .....	38
<b>Bild 6 — Kontaktüberdeckung einer Stift-Buchse-Paarung</b> .....	43
<b>Bild 7 — Taumelspiel der Kontakte in der Gehäusekammer</b> .....	45
<b>Bild 8 — Falltest in Trommel</b> .....	48
<b>Bild 9 — Kraft-Weg-Diagramm der Haltekraft (Weg zur Ermittlung der Kraft nach obiger Definition)</b> .....	50
<b>Bild 10 — Prinzipskizze Verrastung</b> .....	51
<b>Bild 11 — Gehäuse inkl. Sekundärverriegelung</b> .....	54
<b>Bild 12 — Gehäuse mit separater Sekundärverriegelung</b> .....	54
<b>Bild 13 — Messpunkte bei Umgehäuse mit separatem Kontaktträger</b> .....	54
<b>Bild 14 — Messpunkte bei Kontaktträger mit separater Sekundärverriegelung</b> .....	55
<b>Bild 15 — max. möglicher Schrägsteckwinkel</b> .....	57
<b>Bild 16 — Schrägsteckung mit maximal schrägem Stiftkontakt</b> .....	57
<b>Bild 17 — Koshiri-Sicherheit</b> .....	58
<b>Bild 18 — beispielhafte Deratingkurve</b> .....	64
<b>Bild 19 — Deratingkurven für ein Gehäuse mit 2 unterschiedlichen Kontaktgrößen</b> .....	67
<b>Bild 20 — Testzyklus</b> .....	70
<b>Bild 21 — Beispiel zur Ermittlung des Prüfstroms für PG 15</b> .....	71

<b>Bild 22 — beispielhafte Deratingkurve .....</b>	<b>72</b>
<b>Bild 23 — Abbildung PG 17 .....</b>	<b>76</b>
<b>Bild 24 — Beispielhafte Auswertung PG 17 .....</b>	<b>77</b>
<b>Bild 25 — Beispiel 1 für die Befestigung auf dem Schwingtisch.....</b>	<b>79</b>
<b>Bild 26 — Beispiel 2 für die Befestigung auf dem Schwingtisch.....</b>	<b>80</b>
<b>Bild 27 — Vibrationsprofil V1 Rauschen.....</b>	<b>81</b>
<b>Bild 28 — Vibrationsprofil V2 Rauschen.....</b>	<b>82</b>
<b>Bild 29 — Vibrationsprofil V3 Rauschen.....</b>	<b>84</b>
<b>Bild 30 — Vibrationsprofil V3 Sinus.....</b>	<b>84</b>
<b>Bild 31 — Vibrationsprofil V4 Rauschen.....</b>	<b>86</b>
<b>Bild 32 — Vibrationsprofil V4 Sinus.....</b>	<b>86</b>
<b>Bild 33 — Vibrationsprofil V5 Sinus.....</b>	<b>87</b>
<b>Bild 34 — Vibrationsprofil V6 Sinus.....</b>	<b>88</b>
<b>Bild 35 — Bestückungsbeispiel PG20.....</b>	<b>97</b>
<b>Bild 36 — Prinzipskizze des Messaufbaus „Lautstärkemessung“ .....</b>	<b>108</b>
<b>Bild 37 — Ermittlung der Haltekraft des Blindstopfens .....</b>	<b>110</b>
<b>Bild 38 — Schematische Darstellung der relativen Verschiebung des Kontaktes zu seinem Gehäuse um 0,2 mm.....</b>	<b>111</b>
<b>Bild 39 — Kraft-Weg-Darstellung mit dargestelltem Zielkorridor für die Haltekraft .....</b>	<b>112</b>
<b>Bild 40 — Beispielhafte Darstellung Kraft-Weg-Messung.....</b>	<b>114</b>
<b>Bild 41 — Beispielhafte Darstellung Leer-Crimp .....</b>	<b>114</b>
<b>Bild 42 — Beispielhafte Darstellung Leitungsisolierung im Crimp.....</b>	<b>115</b>
<b>Bild 43 — Prüfbablauf PG 32.....</b>	<b>117</b>
<b>Bild 44 — Exemplarische Darstellung der Ergebnisdokumentation .....</b>	<b>119</b>
<b>Bild 45 — Crimp-Kraftverlauf von Gut- und Leer-Crimps und Definition „Headroom“ .....</b>	<b>120</b>
<b>Bild 46 — Richtung der Leitungsbewegung .....</b>	<b>122</b>
<b>Bild 47 — Messaufbau (schematisch) .....</b>	<b>123</b>
<b>Bild 48 — Ausführungsbeispiel Platinenkontakt.....</b>	<b>123</b>
<b>Bild 49 — Ein Temperaturwechselzyklus (TW) .....</b>	<b>126</b>
<b>Bild 50 — Prüfaufbau (schematisch).....</b>	<b>126</b>

<b>Bild 51 — Ein Bewegungszyklus .....</b>	<b>127</b>
<b>Bild 52 — ΔR1 (schematisch).....</b>	<b>128</b>
<b>Bild 53 — ΔR2, ΔR2v und ΔR3 (schematisch) — Höchstwert in Mitte der Bewegungsphase .....</b>	<b>129</b>
<b>Bild 54 — ΔR2, ΔR2v und ΔR3 (schematisch) — Höchstwert am Ende der Bewegungsphase.....</b>	<b>129</b>
<b>Bild 55 — Stabilitätsbewertung ΔR4 .....</b>	<b>129</b>
<b>Bild A.1 — Messung des Isolationswiderstandes zwischen allen benachbarten Kontakten bei Datensteckverbindungen.....</b>	<b>133</b>

## Tabellen

<b>Tabelle 1 — Abkürzungsverzeichnis .....</b>	<b>16</b>
<b>Tabelle 2 — Allgemeine Toleranzen.....</b>	<b>18</b>
<b>Tabelle 3 — Maximale Messströme für Widerstandsmessungen .....</b>	<b>20</b>
<b>Tabelle 4 — Maximale Grenzwerte des Durchgangswiderstands für die statische Widerstandsmessung (mΩ) (E0.2).....</b>	<b>22</b>
<b>Tabelle 5 — Prüfmatrix Kontakte.....</b>	<b>23</b>
<b>Tabelle 6 — Prüfmatrix Gehäuse .....</b>	<b>26</b>
<b>Tabelle 7 — Prüfmatrix Dichtungen / Dichtelemente .....</b>	<b>28</b>
<b>Tabelle 8 — Prüfmatrix Stifteleiste .....</b>	<b>30</b>
<b>Tabelle 9 — Legendendefinition Prüfmatrix .....</b>	<b>31</b>
<b>Tabelle 10 — PG 0 — Matrix Prüfungen und Prüfgegenstände .....</b>	<b>36</b>
<b>Tabelle 11 — Prüfungen PG 1 .....</b>	<b>39</b>
<b>Tabelle 12 — Prüfungen PG 2 .....</b>	<b>40</b>
<b>Tabelle 13 — Prüfungen PG 3 .....</b>	<b>41</b>
<b>Tabelle 14 — Prüfungen PG 4 .....</b>	<b>42</b>
<b>Tabelle 15 — Prüfungen PG 5 .....</b>	<b>44</b>
<b>Tabelle 16 — PG 6 — Betätigungskräfte Sekundärverriegelung .....</b>	<b>46</b>
<b>Tabelle 17 — PG 6 — Bewertungskriterien Falltest.....</b>	<b>48</b>
<b>Tabelle 18 — PG 7 — Anforderungen für Betätigungskräfte Gehäuse / CPA .....</b>	<b>52</b>
<b>Tabelle 19 — PG 7 — Formschlüssige Gehäusehaltekräfte.....</b>	<b>53</b>
<b>Tabelle 20 — PG 7 — Kraftschlüssige Gehäusehaltekräfte .....</b>	<b>53</b>
<b>Tabelle 21 — Prüfungen PG 8 .....</b>	<b>55</b>

<b>Tabelle 22 — PG 8— Kontakthaltekräfte.....</b>	<b>56</b>
<b>Tabelle 23 — Prüfungen PG 10.....</b>	<b>58</b>
<b>Tabelle 24 — PG 10 — Leitungsausreißkräfte .....</b>	<b>59</b>
<b>Tabelle 25 — Prüfungen PG 11.....</b>	<b>60</b>
<b>Tabelle 26 — Prüfungen PG 12.....</b>	<b>62</b>
<b>Tabelle 27 — PG 12 — Beispiel Wertetabelle <math>T_{Grenz} + 150 \text{ }^{\circ}\text{C}</math>.....</b>	<b>63</b>
<b>Tabelle 28 — PG 13 — Kontaktgrößen in Abhängigkeit Leiternennquerschnitt .....</b>	<b>65</b>
<b>Tabelle 29 — Prüfungen PG 13 — Kontaktfreigabe und Gehäusefreigabe Fall 1 (identische Kontaktgröße).....</b>	<b>65</b>
<b>Tabelle 30 — Prüfungen PG 13 — Gehäusefreigabe Fall 2 (unterschiedliche Kontaktgrößen) .....</b>	<b>66</b>
<b>Tabelle 31 — Prüfungen PG 14.....</b>	<b>68</b>
<b>Tabelle 32 — PG 15 — Beispielhafte Auswertung Derating .....</b>	<b>73</b>
<b>Tabelle 33 — Prüfungen PG 16.....</b>	<b>73</b>
<b>Tabelle 34 — Prüfungen PG 17 — Prüfungsablauf „Aufbau Ebene 1“ .....</b>	<b>77</b>
<b>Tabelle 35 — Prüfungen PG 17 — Prüfungsablauf „Umbau auf Ebene 2“ .....</b>	<b>78</b>
<b>Tabelle 36 — Prüfungen PG 17 — Prüfungsablauf „Umbau auf Ebene 3“ .....</b>	<b>78</b>
<b>Tabelle 37 — Temperaturprofil DIN EN 60068-2-14 / 1 Zyklus.....</b>	<b>80</b>
<b>Tabelle 38 — Rauschen DIN EN 60068-2-64.....</b>	<b>80</b>
<b>Tabelle 39 — Mechanischer Schock DIN EN 60068-2-27 .....</b>	<b>81</b>
<b>Tabelle 40 — Temperaturprofil DIN EN 60068-2-14 / 1 Zyklus.....</b>	<b>81</b>
<b>Tabelle 41 — Rauschen DIN EN 60068-2-64.....</b>	<b>82</b>
<b>Tabelle 42 — Mechanischer Schock DIN EN 60068-2-27 .....</b>	<b>82</b>
<b>Tabelle 43 — Temperaturprofil DIN EN 60068-2-14 / 1 Zyklus.....</b>	<b>83</b>
<b>Tabelle 44 — Rauschen DIN EN 60068-2-64.....</b>	<b>83</b>
<b>Tabelle 45 — Sinus DIN EN 60068-2-6 .....</b>	<b>84</b>
<b>Tabelle 46 — Temperaturprofil DIN EN 60068-2-14 / 1 Zyklus.....</b>	<b>85</b>
<b>Tabelle 47 — Rauschen DIN EN 60068-2-64.....</b>	<b>85</b>
<b>Tabelle 48 — Sinus DIN EN 60068-2-6 .....</b>	<b>86</b>
<b>Tabelle 49 — Temperaturprofil DIN EN 60068-2-14 / 1 Zyklus.....</b>	<b>86</b>
<b>Tabelle 50 — Sinus DIN EN 60068-2-6 .....</b>	<b>87</b>

<b>Tabelle 51 — Temperaturprofil DIN EN 60068-2-14 / 1 Zyklus.....</b>	<b>88</b>
<b>Tabelle 52 — Sinus DIN EN 60068-2-6.....</b>	<b>88</b>
<b>Tabelle 53 — Prüfungen PG 17 — Resonanzfrequenz .....</b>	<b>89</b>
<b>Tabelle 54 — Sinus DIN EN 60068-2-6 .....</b>	<b>89</b>
<b>Tabelle 55 — Prüfungen PG 18A.....</b>	<b>90</b>
<b>Tabelle 56 — Prüfungen PG 18C .....</b>	<b>91</b>
<b>Tabelle 57 — PG 19 — Prüfgruppen .....</b>	<b>92</b>
<b>Tabelle 58 — Prüfungen PG 19 .....</b>	<b>92</b>
<b>Tabelle 59 — Schwingprüfung Rauschen.....</b>	<b>95</b>
<b>Tabelle 60 — Prüfungen PG 20 .....</b>	<b>97</b>
<b>Tabelle 61 — Prüfungen PG 21.....</b>	<b>99</b>
<b>Tabelle 62 — Prüfungen PG 22A.....</b>	<b>100</b>
<b>Tabelle 63 — PG 22A — Medienmatrix.....</b>	<b>101</b>
<b>Tabelle 64 — Prüfungen PG 22B .....</b>	<b>101</b>
<b>Tabelle 65 — PG 22B — Medienmatrix.....</b>	<b>102</b>
<b>Tabelle 66 — Prüfungen PG 23 .....</b>	<b>104</b>
<b>Tabelle 67 — Prüfungen PG 28.....</b>	<b>107</b>
<b>Tabelle 68 — Prüfungen PG 29 .....</b>	<b>109</b>
<b>Tabelle 69 — Prüfungen PG 31.....</b>	<b>110</b>
<b>Tabelle 70 — PG 31 — Haltekräfte der Stiftkontakte .....</b>	<b>112</b>
<b>Tabelle 71 — PG 32 — Konstruktionsrichtwerte .....</b>	<b>116</b>
<b>Tabelle 72 — PG 32 — Grenzwerte .....</b>	<b>116</b>
<b>Tabelle 73 — PG 33 — Grenzwerte für ΔR .....</b>	<b>130</b>
<b>Tabelle 74 — PG 33 — ΔR Bewertungen .....</b>	<b>130</b>
<b>Tabelle 75 — Prüfungen PG 34 .....</b>	<b>131</b>
<b>Tabelle A.1 — Matrix Prüfungen und Prüfgegenstände PG 0 für Datensteckverbindungen.....</b>	<b>133</b>
<b>Tabelle A.2 — Formschlüssige Gehäusehaltekraft für Datensteckverbindungen .....</b>	<b>134</b>
<b>Tabelle A.3 — Kontakthaltekraft für Datensteckverbindungen.....</b>	<b>134</b>
<b>Tabelle A.4 — Leitungsausreißkraft für Datensteckverbindungen .....</b>	<b>134</b>
<b>Tabelle A.5 — Haltekraft der Stiftkontakte für Datensteckverbindungen .....</b>	<b>136</b>